

針測行程標準化系統對晶圓測試影響之研究-以新竹某公司之測試部門為例

賀力行, 謝志豪

科技管理學系

管理學院

ho@chu.edu.tw

摘要

近年來，國內半導體產業蓬勃發展，對於測試產能之要求更加提高，因此如何以現有測試的設備，提高測試產能，減少生產效率之損失，對於台灣半導體測試業是一個相當重要的課題。本研究對某個案公司測試部門為調查對象，藉由問卷調查及深入訪談方式，探討運用針測行程標準化系統之對晶圓測試效益之影響，期望以本研究之探討，可提供業界未來導入此系統參考指引。

關鍵字：晶圓測試、針測行程、OverDriver